

SMART TESTER Series

for *Hard Disk Drive* & *Solid State Drive*

ストレージメディア用 高機能信頼性評価装置

■ 世界標準のベンチマークテスト & 専門性・自由度の高いベンダーユニークテストをサポート ■

SMART TESTER for 6G

【Support Interface SATA 3/SAS 2】



SMART TESTER for PCIe

【Support Interface PCIe Gen 3(4Lane)】



SMART TESTER for PCIe G4

【Support Interface PCIe Gen 4 (4Lane)】



NVMe 1.4

▼ 主な評価機能

基本情報管理

SMART 情報取得・ユーザー閾値判定
Secure Erase 容量リッピング(SATA)

Que depth 取得・管理
各種コマンド発行によるアクセス

Basic Function

性能評価

SNIA SSS PTS 方式サポート
SSDの限界性能(定常状態)計測

電力・書込み劣化劣化との相関確認
ガーベージコレクションの状態確認

Performance

書き込み耐性評価

TBW(JEDEC218/219)評価方式に準拠した評価 (Endurance, Read Disturb, Data Retention)
Used percentage の予測評価と性能相関確認

Endurance

信頼性/耐久性評価

電源遮断耐性評価(書き込みデータ保持性確認)
電圧マージン評価 電源ON/OFF評価 電流電圧計測

Power Management

省電力評価

CLKREQ# for PCIe(μ Ampere Measurement)
Device Sleep for SATA

Power Efficiency

製品仕様

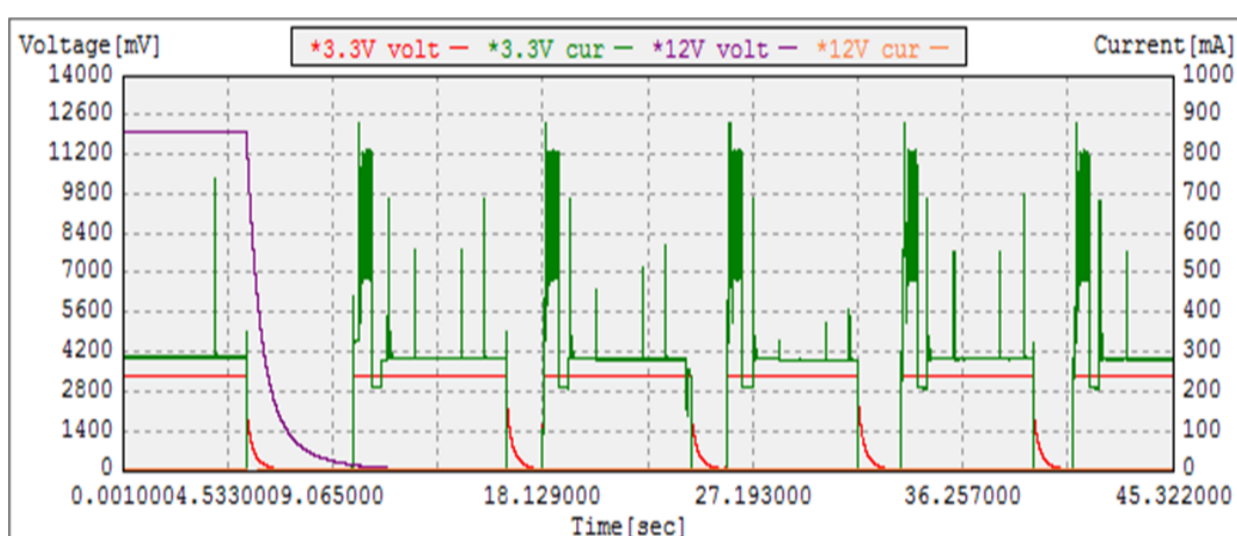
項目	SMART TESTER for 6G	SMART TESTER for PCIe
型式	S64PV1-F3	Gen3:H4PR-P3F4 Gen4:H4PC-P4
インターフェイス	SATA_3 SAS_2(op) PATA(op)	PCIe Gen3/Gen4 (4Lane) Support Protocol:NVMe, AHCI
評価デバイス	HDD:3.5inch/2.5inch SSD :2.5inch / M.2(2230-22110) CompactFlash / Cfast / mSATA	Add-in Card(Standard) M.2(2230-22110) / U.2(SFF8639) Cfexpress card / E1.S / E1.L / E3.S
評価ポート	4port/台	4port/台
入力電源	AC95~245V 50/60Hz	AC95~245V 50/60Hz
外形寸法	W259*D258*H58mm	Gen3 : W370×D310×H530mm Gen4 : W420×D460×H350mm

※1. 仕様は予告なく変更になる場合がございます。 操作用パソコンは、本製品構成に含まれていません。
 ※2. 制御性能、測定分解能については、お問い合わせください。

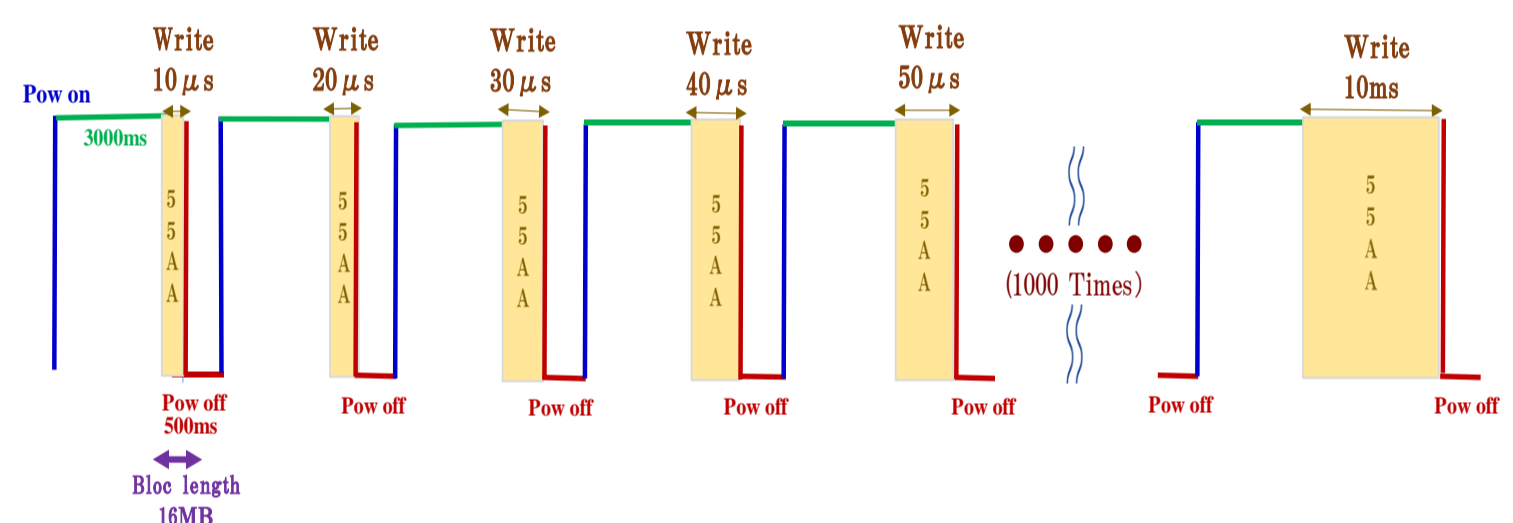
Test Sample

アクセスワークロードを多彩に組み合わせ 専門性の高い総合評価を柔軟に実行します

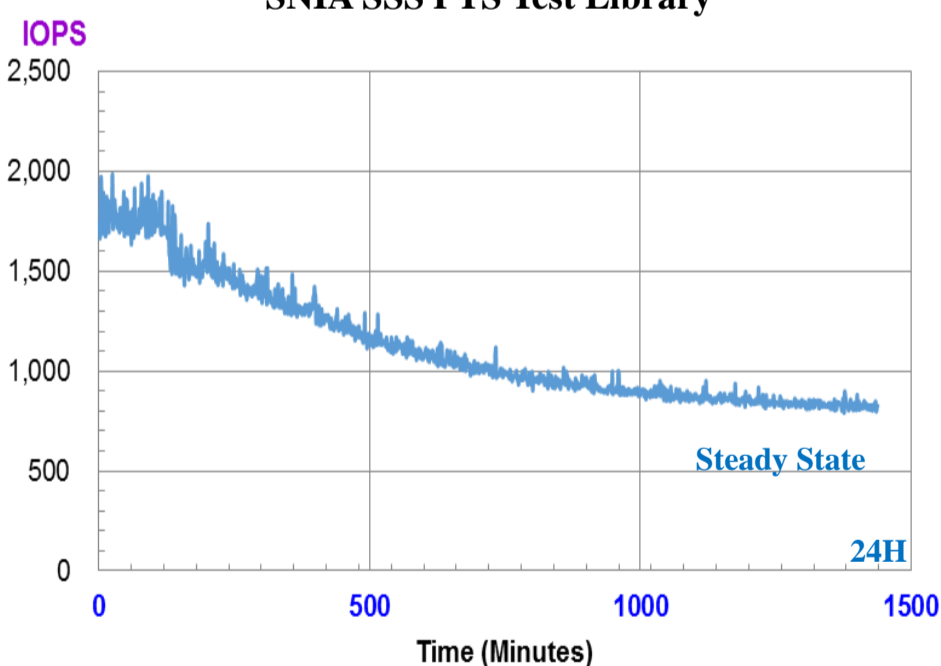
〈Power ON/OFF Test〉



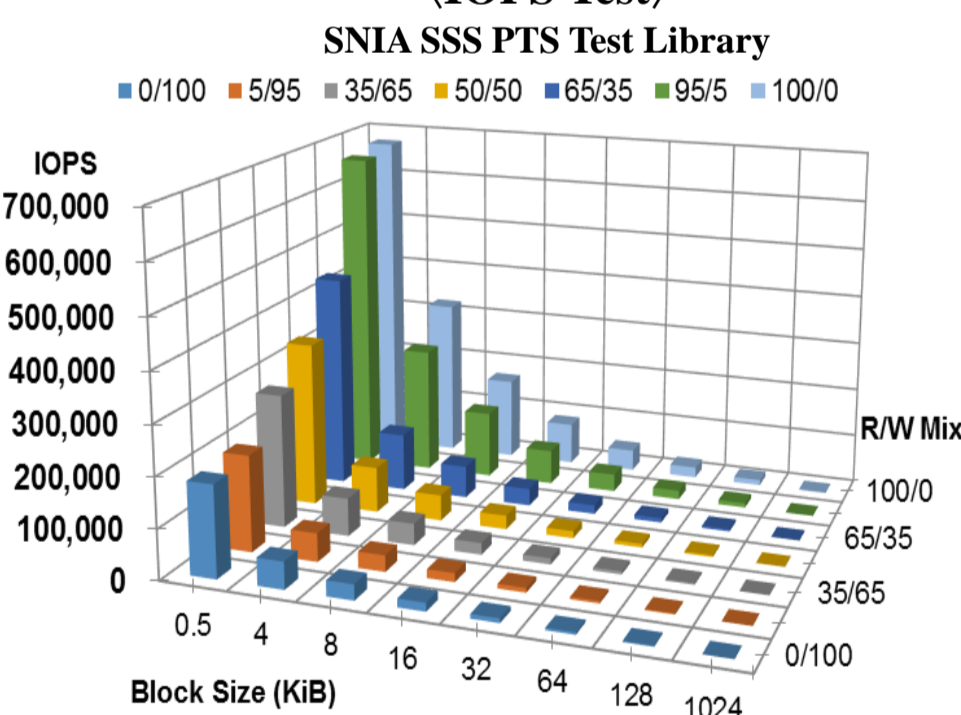
〈Power Shut down Test image〉



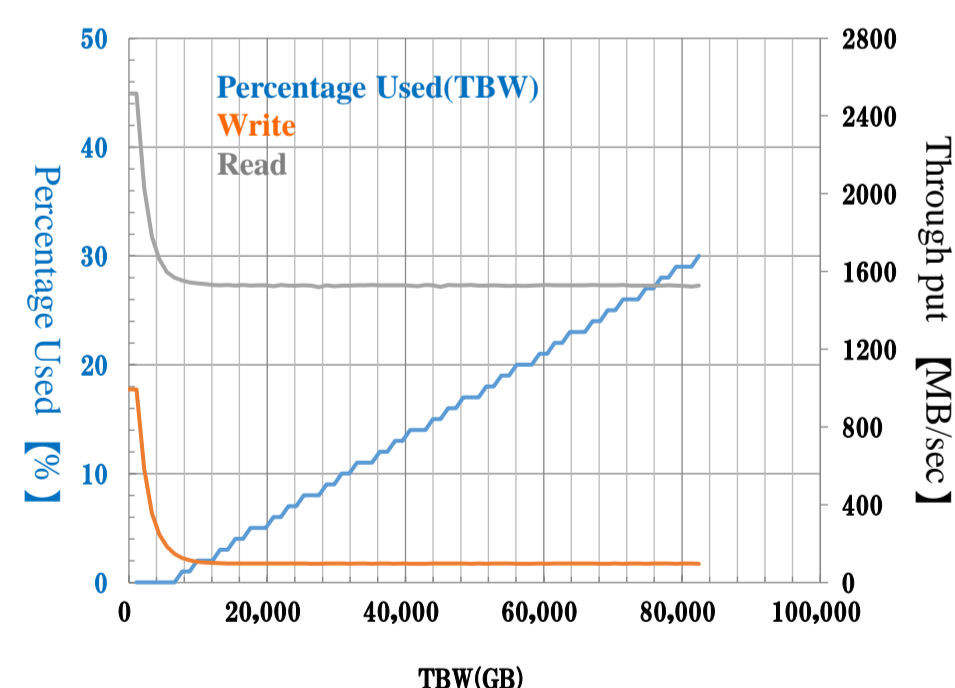
〈Write Saturation Test〉
SNIA SSS PTS Test Library



〈IOPS Test〉



〈Endurance vs Performance〉



お客様のご用途に合わせた評価方法のご提案、及び評価サービスを賜っております。お気軽にご相談ください

《製造販売元》

《販売代理店》



〒382-0005
長野県須坂市大字小河原3954番地13

TEL:026-245-1212 FAX:026-246-1474

お問い合わせメールアドレス
info@hirotass.co.jp

